化学分析：目次

用 語

JIS K 0147-1 : 2017	表面化学分析—用語—第1部：一般用語及び分光法に関する用語……	ISO 18115-1 : 2013 (IDT) ……	17
JIS K 0147-2 : 2017	表面化学分析—用語—第2部：走査型プローブ顕微鏡に関する用語……	ISO 18115-2 : 2013 (IDT) ……	134
JIS K 0211 : 2013	分析化学用語(基礎部門) ……		194
JIS K 0212 : 2016	分析化学用語(光学部門) ……		252
JIS K 0213 : 2014	分析化学用語(電気化学部門) ……		311
JIS K 0214 : 2013	分析化学用語(クロマトグラフィー部門) ……		359
JIS K 0215 : 2016	分析化学用語(分析機器部門) ……		422
JIS K 0216 : 2014	分析化学用語(環境部門) ……		519
JIS Z 8144 : 2004	官能評価分析—用語 ……	ISO 5492 : 1992 (MOD) ……	585
JIS Z 8462-1 : 2001	測定方法の検出能力—第1部：用語及び定義 ……	ISO 11843-1 : 1997 (IDT) ……	600

標準物質

JIS B 9624 : 2007	印刷技術及び写真技術—反射及び透過測定用認証標準物質(CRM)の保証に必要な付随文書及び使用手順、並びに反射及び透過測定システムの合成標準不確かさの求め方 ……	ISO 15790 : 2004 (IDT) ……	609
JIS K 8005 : 2014	容量分析用標準物質 ……		625
JIS K 8005 : 2016	(追補1) ……		798
JIS Q 0030 : 2019	標準物質—選択された用語及び定義(解説収録) ……	ISO Guide 30 : 2015 (IDT) ……	837
JIS Q 0031 : 2018	標準物質—認証書、ラベル及び附属文書の内容(解説収録) ……	ISO Guide 31 : 2015 (IDT) ……	848
JIS Q 0033 : 2019	標準物質—標準物質の適正な使い方(解説収録) ……	ISO Guide 33 : 2015 (IDT) ……	860
JIS Q 0035 : 2022	標準物質—値付け並びに均質性及び安定性の評価に関する手引 ……	ISO Guide 35 : 2017 (IDT) ……	893
JIS Q 17034 : 2018	標準物質生産者の能力に関する一般要求事項(解説収録) ……	ISO 17034 : 2016 (IDT) ……	1000
JIS Z 8461 : 2001	標準物質を用いた校正(検量線が直線の場合) ……	ISO 11095 : 1996 (IDT) ……	1026

通則・分析方法

JIS K 0050 : 2019	化学分析方法通則	1053
JIS K 0055 : 2002	ガス分析装置校正方法通則	1089
JIS K 0111 : 1983	ポーラログラフ分析のための通則	1096
JIS K 0113 : 2005	電位差・電流・電量・カールフィッシャー滴定方法通則	1115
	ISO 760 : 1978(MOD)	1115
JIS K 0114 : 2012	ガスクロマトグラフィー通則	1131
JIS K 0115 : 2020	吸光光度分析通則	1159
JIS K 0116 : 2014	発光分光分析通則	1187
JIS K 0117 : 2017	赤外分光分析通則	1214
JIS K 0119 : 2008	蛍光X線分析通則	1241
JIS K 0120 : 2005	蛍光光度分析通則	1256
JIS K 0121 : 2006	原子吸光分析通則	1268
JIS K 0122 : 1997	イオン電極測定方法通則	1286
JIS K 0123 : 2018	ガスクロマトグラフィー質量分析通則	1302
JIS K 0124 : 2011	高速液体クロマトグラフィー通則	1357
JIS K 0126 : 2019	流れ分析通則	1394
JIS K 0127 : 2013	イオンクロマトグラフィー通則	1423
JIS K 0129 : 2005	熱分析通則	1445
JIS K 0130 : 2008	電気伝導率測定方法通則	1457
JIS K 0131 : 1996	X線回折分析通則	1465
JIS K 0132 : 1997	走査電子顕微鏡試験方法通則	1478
㊦ JIS K 0133 : 2022	誘導結合プラズマ質量分析通則	1491
JIS K 0134 : 2002	近赤外分光分析通則	1546
JIS K 0135 : 2003	分取液体クロマトグラフィー通則	1555
JIS K 0136 : 2015	高速液体クロマトグラフィー質量分析通則	1564
JIS K 0137 : 2010	ラマン分光分析通則	1589
JIS K 0138 : 2018	定量核磁気共鳴分光法通則(qNMR通則) (解説収録)	1602
JIS K 0144 : 2018	表面化学分析—グロー放電発光分光分析方法通則	1654
	ISO 14707 : 2015(IDT)	1654
JIS K 0145 : 2002	表面化学分析—X線光電子分光装置—エネルギー軸目盛の校正	1664
	ISO 15472 : 2001(IDT)	1664
JIS K 0146 : 2002	表面化学分析—スパッター深さ方向分析—層構造系標準物質を用いた最適化法	1684
	ISO 14606 : 2000(IDT)	1684
JIS K 0149-1 : 2019	マイクロビーム分析—走査電子顕微法—第1部：像倍率校正方法	1694
	ISO 16700 : 2016(IDT)	1694
JIS K 0150 : 2020	表面化学分析—亜鉛及び／又はアルミニウム基金属めっきのグロー放電発光分光分析方法	1710
	ISO 16962 : 2017(IDT)	1710

JIS K 0152 : 2014	表面化学分析—X線光電子分光法—強度目盛の繰返し性、再現性及び 一定性……………ISO 24237 : 2005 (IDT) …… 1747
JIS K 0153 : 2015	表面化学分析—二次イオン質量分析法—スタティック二次イオン質量分 析法における相対イオン強度目盛の繰返し性、再現性及び一定性の確認 方法……………ISO 23830 : 2008 (IDT) …… 1762
JIS K 0154 : 2017	表面化学分析—分析試料の準備及び取付けに関する指針…………… ……………ISO 18116 : 2005 (IDT) …… 1774
JIS K 0155 : 2018	表面化学分析—二次イオン質量分析法—単一イオン計数飛行時間形質量 分析器における強度軸の線形性……………ISO 17862 : 2013 (MOD) …… 1790
JIS K 0156 : 2018	表面化学分析—二次イオン質量分析法—デルタ多層標準物質を用いたシリ コンの深さ校正方法……………ISO 23812 : 2009 (IDT) …… 1817
JIS K 0157 : 2021	表面化学分析—二次イオン質量分析法—飛行時間形二次イオン質量分析 計における質量軸の校正……………ISO 13084 : 2018 (IDT) …… 1835
JIS K 0158 : 2021	表面化学分析—二次イオン質量分析法—単一イオン計測ダイナミック二次 イオン質量分析法における飽和強度の補正法……………ISO 20411 : 2018 (IDT) …… 1850
JIS K 0159 : 2021	表面化学分析—走査型プローブ顕微鏡 (SPM) を用いた幾何学量の測定： 測定系の校正方法……………ISO 11952 : 2019 (IDT) …… 1865
JIS K 0160 : 2009	表面化学分析—シリコンウェーハ表面からの金属の化学的回収方法及び 全反射蛍光X線 (TXRF) 分析法による定量方法…………… ……………ISO 17331 : 2004 (IDT) …… 1921
JIS K 0161 : 2010	表面化学分析—オージェ電子分光法—装置性能を示す主要な項目の記 載方法……………ISO 15471 : 2004 (MOD) …… 1933
JIS K 0162 : 2010	表面化学分析—X線光電子分光法—装置性能を示す主要な項目の記載 方法……………ISO 15470 : 2004 (MOD) …… 1940
JIS K 0163 : 2010	表面化学分析—二次イオン質量分析法—イオン注入標準物質を用いた相 対感度係数の決定方法……………ISO 18114 : 2003 (IDT) …… 1947
㊦ JIS K 0164 : 2023	表面化学分析—二次イオン質量分析法—シリコン内のボロンの深さ方向 分布測定方法……………ISO 17560 : 2014 (IDT) …… 1950
JIS K 0165 : 2011	表面化学分析—汎用オージェ電子分光器による元素分析のためのエネル ギー軸の校正方法……………ISO 17973 : 2002 (MOD) …… 1959
JIS K 0166 : 2011	表面化学分析—高エネルギー分解能をもつオージェ電子分光器による元 素分析及び化学結合状態分析のためのエネルギー軸の校正方法…………… ……………ISO 17974 : 2002 (MOD) …… 1969
JIS K 0167 : 2011	表面化学分析—オージェ電子分光法及びX線光電子分光法—均質物質 定量分析のための実験的に求められた相対感度係数の使用指針…………… ……………ISO 18118 : 2004 (IDT) …… 1992
JIS K 0168 : 2011	表面化学分析—スタティック二次イオン質量分析法の情報フォーマット …… ……………ISO 22048 : 2004 (IDT) …… 2009
JIS K 0169 : 2012	表面化学分析—二次イオン質量分析法—デルタ多層標準物質を用いた深 さ分解能パラメータ評価方法……………ISO 20341 : 2003 (IDT) …… 2015

JIS K 0181 : 2021	表面化学分析—水溶液の全反射蛍光X線分析方法	ISO 20289 : 2018 (IDT) … 2019
⑨ JIS K 0182 : 2023	表面化学分析—走査型プローブ顕微鏡—カンチレバーの垂直ばね定数の決定方法	ISO 11775 : 2015 (IDT) … 2037
JIS K 0189 : 2013	マイクロビーム分析—電子プローブマイクロ分析—波長分散X線分光法のパラメータの決定方法	ISO 14594 : 2003 (MOD) … 2062
JIS K 0190 : 2010	マイクロビーム分析—電子プローブマイクロ分析—波長分散X線分光法による点分析における定性分析のための指針	ISO 17470 : 2004 (MOD) … 2078
⑨ JIS K 0199 : 2023	異なる顕微測定装置間における同一箇所分析のための位置合わせ手順(解説収録)	2086
JIS K 3812 : 2003	電気泳動分析通則	2098
JIS K 3813 : 2003	キャピラリー電気泳動分析通則	2104
JIS K 3838 : 1995	SDS—ポリアクリルアミドゲル電気泳動分析通則(解説収録)	2109
JIS Z 8710 : 1993	温度測定方法通則(抜粋)	2124
JIS Z 8815 : 1994	ふるい分け試験方法通則(解説収録)	ISO 2591-1 : 1988 (MOD) … 2140
JIS Z 9080 : 2004	官能評価分析—方法	ISO 4120 : 1983, 4121 : 1987, 5495 : 1983, 6658 : 1985, 8587 : 1988 (MOD) … 2152

水

JIS K 0557 : 1998	用水・排水の試験に用いる水	2197
JIS K 0558 : 2002	超純水中のほう素試験方法	2201
JIS K 0550 : 1994	超純水中の細菌数試験方法	2204
JIS K 0551 : 1994	超純水中の有機体炭素(TOC)試験方法	2212
JIS K 0552 : 1994	超純水の電気伝導率試験方法	2218
JIS K 0553 : 2002	超純水中の金属元素試験方法	2221
JIS K 0554 : 1995	超純水中の微粒子測定方法	2250
JIS K 0555 : 1995	超純水中のシリカ試験方法	2258
JIS K 0555 : 2009	(追補1)	2263
JIS K 0556 : 1995	超純水中の陰イオン試験方法	2264

試験・測定方法

JIS K 0061 : 2022	化学製品の密度及び比重測定方法	ISO 758 : 1976 (MOD) … 2275
JIS K 0062 : 1992	化学製品の屈折率測定方法	2320
JIS K 0063 : 1992	化学製品の旋光度測定方法	2325
JIS K 0064 : 1992	化学製品の融点及び溶融範囲測定方法	2330
JIS K 0065 : 1992	化学製品の凝固点測定方法	2334
JIS K 0066 : 1992	化学製品の蒸留試験方法	ISO 918 : 1983 (IDT) … 2336
JIS K 0067 : 1992	化学製品の減量及び残分試験方法	2344

JIS K 0068 : 2001	化学製品の水分測定方法	2351
JIS K 0069 : 1992	化学製品のふるい分け試験方法	2367
JIS K 0070 : 1992	化学製品の酸価, けん化価, エステル価, よう素価, 水酸基価及び不けん化物の試験方法	2372
JIS K 0071-1 : 2017	化学製品の色試験方法—第1部: ハーゼン単位色数(白金-コバルトスケール)	ISO 2211 : 1973, 6271 : 2015(MOD) 2380
JIS K 0071-2 : 1998	化学製品の色試験方法—第2部: ガードナー色数	ISO/DIS 4630.2 : 1996(MOD) 2391
JIS K 0071-3 : 1998	化学製品の色試験方法—第3部: セーボルト色数	2395
JIS K 0071-4 : 1998	化学製品の色試験方法—第4部: ASTM色数	2401
JIS K 0072 : 1998	化学製品の硫酸着色試験方法	2404
JIS Z 8462-2 : 2003	測定方法の検出能力—第2部: 検量線が直線である場合の方法	ISO 11843-2 : 2000(IDT) 2409
JIS Z 8462-5 : 2011	測定方法の検出能力—第5部: 検量線が線形及び非線形である場合の方法	ISO 11843-5 : 2008(IDT) 2424
JIS Z 8462-6 : 2018	測定方法の検出能力—第6部: 測定値がポアソン分布に従う場合の限界値及び検出可能な最小値を正規分布近似によって求める方法	ISO 11843-6 : 2013(IDT) 2434
JIS Z 8462-7 : 2018	測定方法の検出能力—第7部: 分析機器ノイズの確率論的性質に基づく方法	ISO 11843-7 : 2012(IDT) 2452
JIS Z 8703 : 1983	試験場所の標準状態(解説抜粋)	ISO 554 : 1976, IEC 60160 : 1963(MOD) 2470
JIS Z 8704 : 1993	温度測定方法—電気的方法	2473
JIS Z 8705 : 1992	ガラス製温度計による温度測定方法	2488
JIS Z 8705 : 2006	(追補1)	2494
JIS Z 8802 : 2011	pH測定方法	2495
JIS Z 8806 : 2001	湿度—測定方法	2501

データの取扱い

JIS Z 8401 : 2019	数値の丸め方	2531
JIS Z 8402-1 : 1999	測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)—第1部: 一般的な原理及び定義	ISO 5725-1 : 1994(IDT) 2533
JIS Z 8402-2 : 1999	測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)—第2部: 標準測定方法の併行精度及び再現精度を求めるための基本的な方法	ISO 5725-2 : 1994(IDT) 2547
JIS Z 8402-6 : 1999	測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)—第6部: 精確さに関する値の実用的な使い方	ISO 5725-6 : 1994(IDT) 2580
JIS Z 9041-1 : 1999	データの統計的な解釈方法—第1部: データの統計的記述	2613

参 考

原子量表	2641
JISの“まえがき”の省略	2645
ISO, IECが発行する規格・出版物の著作権	2646